



中华人民共和国国家标准

GB/T 6217—1998
idt IEC 747-7-1:1989
QC 750102

半导体器件 分立器件 第7部分:双极型晶体管 第一篇 高低频放大环境额定的双极型 晶体管空白详细规范

Semiconductor devices—Discrete devices
Part 7: Bipolar transistors
Section One—Blank detail specification for
ambient-rated bipolar transistors
for low and high frequency amplification

1998-11-17 发布

1999-06-01 实施

国家质量技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
半 导 体 器 件 分 立 器 件
第 7 部 分：双 极 型 晶 体 管
第 一 篇 高 低 频 放 大 环 境 额 定 的 双 极 型
晶 体 管 空 白 详 细 规 范

GB/T 6217—1998

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.bzcb.com>

电话：63787337、63787447

1999年6月第一版 2004年12月电子版制作

*

书号：155066·1-15868

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

前 言

本规范是等同采用国际标准 IEC 747-7-1:1989《半导体器件 分立器件 高低频放大环境额定的双极型晶体管空白详细规范》第一版对 GB/T 6217—1986 进行修订的。

本规范与前版的主要差别是增加了配对晶体管的技术要求。

本规范由中华人民共和国电子工业部提出。

本规范由全国半导体器件标准化技术委员会归口。

本规范由电子工业部标准化研究所负责起草。

本规范主要起草人：王长福、顾振球、邓康、黄世杰。

IEC 前言

1) IEC(国际电工委员会)在技术问题上的正式决议或协议,是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员会制定的,对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见。

2) 这些决议或协议,以推荐标准的形式供国际上使用,并在此意义上为各国家委员会所认可。

3) 为了促进国际间的统一,IEC 希望各国家委员会在本国条件许可的情况下,采用 IEC 标准的文本作为其国家标准,IEC 标准与相应国家标准之间的差异,应尽可能在国家标准中指明。

本标准由国际电工委员会第 47 技术委员会(半导体器件)制定。

本标准是高低频放大环境额定的双极型晶体管空白详细规范。

本标准文本以下列文件为依据:

六个月法	表决报告
47(CO)956 和 47(CO)983	47(CO)971 和 47(CO)1027

表决批准本标准的详细资料可在上表所列的表决报告中查阅。

本标准封面上的 QC 号是国际电工委员会电子元器件质量评定体系(IECQ)的规范号。

本标准中引用的其他 IEC 标准:

IEC 68-2-17:1978 基本环境试验程序 第 2 部分:试验 试验 Q:密封

IEC 191-2:1966 半导体器件的机械标准化 第 2 部分:尺寸(在修订中)

IEC 747-2:1983 半导体器件 分立器件 第 2 部分:整流二极管

IEC 747-7:1988 半导体器件 分立器件 第 7 部分:双极型晶体管

IEC 747-10:1984 半导体器件 第 10 部分:分立器件和集成电路总规范

IEC 747-11:1985 半导体器件 第 11 部分:分立器件分规范

IEC 749:1984 半导体器件 机械和气候试验方法

中华人民共和国国家标准

半导体器件 分立器件

第7部分:双极型晶体管

第一篇 高低频放大环境额定的双极型

晶体管空白详细规范

Semiconductor devices—Discrete devices
Part 7: Bipolar transistors
Section One—Blank detail specification for
ambient-rated bipolar transistors
for low and high frequency amplification

GB/T 6217—1998
idt IEC 747-7-1:1989
QC 750102
代替 GB/T 6217—1986

引言

本空白详细规范规定了制定高低频放大环境额定的双极型晶体管详细规范的基本原则,制定该范围内的所有详细规范应与本空白详细规范一致。

本空白规范是与 GB/T 4589.1—1989《半导体器件 分立器件和集成电路总规范》(IEC 747-10:1984)和 GB/T 12560—1990《半导体器件 分立器件分规范》(IEC 747-11:1985)有关的一系列空白详细规范中的一个。

要求资料

下列所要求的各项内容,应列入规定的相应空栏中。

详细规范的识别

- [1] 授权起草详细规范的国家标准机构名称。
- [2] IECQ 详细规范号。
- [3] 总规范号和分规范号以及年代号。
- [4] 详细规范号、发布日期和国家体系要求的任何更多的资料。

器件的识别

- [5] 器件型号。

[6] 典型结构和应用资料。如果设计一种器件满足若干应用,则应在详细规范中指出。这些应用的特性、极限值和检验要求均应予以满足。如果器件对静电敏感或含有害物质,例如氧化铍,则应在详细规范中附加注意事项。

- [7] 外形图和(或)引用有关的外形标准。

- [8] 质量评定类别。

- [9] 能在各器件型号之间比较的最重要特性的参考数据。

[在方括号内给出的内容供指导规范制订者使用,而不包括在详细规范内。]

[整个空白详细规范中,当特性或额定值适用时,X 表示在详细规范中应填入的值。]